

Dispozitiv de măsurare a parametrilor senzorilor pe bază de oxizi semiconductori micro- și nanostructurați, care include o sursă de tensiune de referință (U_{ref}), tensiunea căreia se aplică la intrarea unuia din convertorii analogic-digitali (ADC) ai unui microcontroler (MCU) printr-un amplificator operațional, și care este conectată în serie cu o nanostructură cercetată (R_x) și un rezistor suplimentar (R_0), iar căderea de tensiune de pe rezistorul suplimentar (R_0) se aplică la intrarea unui al doilea convertor analogic-digital (ADC) al microcontrolerului (MCU) prin cel de-al doilea amplificator operațional; ieșirea microcontrolerului (MCU) este conectată la un ecran pentru afișarea rezultatelor obținute.